

---

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 2003/2004

Februari/Mac 2004

**ZAT 387/4 - Proses Fabrikasi Semikonduktor**

Masa : 3 jam

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **EMPAT** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua **LIMA** soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan semikonduktor hablur tunggal, polihablur dan amorfos?  
(6/20)
  - (b) Perihalkan dengan jelas perkara berikut:
    - (i) teknik penumbuhan jongkong silikon menggunakan proses Czochralski  
(5/20)
    - (ii) teknik penumbuhan lapisan epitaksi sebatian III-V menggunakan proses epitaksi alur molekul  
(5/20)
  - (c) Sebanyak 5 kg silikon dimasukkan ke dalam satu mangkuk pijar. Berapa gram fosforus yang perlu ditambahkan jika hablur tunggal yang ditumbuhkan nanti hanya mempunyai kepekatan bendasing  $10^{16}$  atom fosforus/cm<sup>3</sup>?  
(Pekali taburan bagi fosforus ialah 0.35. Berat atomik fosforus ialah 31. Ketumpatan Si ialah 2.33 g/cm<sup>3</sup>)  
(4/20)
- 
2. (a) Tujuan utama penggunaan bilik bersih ialah untuk mengawal pencemaran semasa pemprosesan.
    - (i) Nyatakan pengkelasan bilik bersih mengikut US Federal Standard 209B. Apakah kelas bilik bersih yang sesuai untuk fabrikasi IC (litar bersepadu) dengan saiz struktur kurang dari 1μm?  
(5/20)
    - (ii) Huraikan ciri-ciri penting dalam pembinaan dan rekabentuk bilik bersih  
(8/20)
  - (b) Pembersihan wafer adalah aspek yang penting sebelum pemprosesan wafer.
    - (i) Nyatakan spesifikasi air tulen (DI) yang digunakan dalam pembersihan wafer.  
(2/20)
    - (ii) Terangkan bagaimana filem organik dapat dicuci dari permukaan wafer silikon.  
(5/20)

3. (a) Anda diberi sekeping wafer silikon. Terangkan bagaimana anda dapat menentukan jenis dan orientasi wafer hanya berdasarkan pemerhatian bentuk wafer tersebut. (5/20)
- (b) Di dalam pengujian menggunakan kaedah prob terma didapati bahawa prob panas berkeupayaan lebih negatif daripada prob sejuk. Mengapaakah perkara ini berlaku? Apakah yang boleh dikatakan mengenai bahan ini? (5/20)
- (c) Aloi Al-Cu adalah bahan yang sering digunakan sebagai logam antara sambungan dalam litar bersepadu. Kerintangan  $\rho$  aloi ini adalah  $3.2 \mu\Omega \cdot cm$  dan tebal serta lebar garis logam tersebut adalah  $1 \mu m$  masing-masing, manakala panjangnya adalah  $100 \mu m$ . Dapatkan rintangan  $R$  logam antara sambungan ini. (4/20)
- (d) Apakah yang dimaksudkan dengan rintangan keping,  $R_s$ ? Huraikan teknik yang digunakan untuk mengukur rintangan keping suatu lapisan semikonduktor. (6/20)
4. (a) Jelaskan peranan silikon dioksida sebagai topeng di dalam proses fabrikasi semikonduktor dan nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penumbuhan oksida. (5/20)
- (b) Terangkan kelemahan punaran basah berbanding dengan punaran kering dalam proses fabrikasi semikonduktor. (5/20)
- (c) Huraikan ketiga-tiga teknik optik litografi untuk cetakan corak pada fotorintang (5/20)
- (d) Bagi proses pengedopan silikon dengan boron melalui teknik resapan pada suhu  $1000^\circ C$ , kepekatan dopan pada permukaan ditetapkan pada  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , dan masa resapan adalah 1 jam. Dapatkan nilai  $Q(t)$ , iaitu jumlah keseluruhan atom dopan per unit luas. (Pekali resapan boron pada  $1000^\circ C$  adalah  $2 \times 10^{14} \text{ cm}^2/\text{s}$ ). (5/20)

5. (a) Pemendapan vakum memerlukan penggunaan pam. Pada masa ini tidak ada satu pam yang boleh digunakan untuk mengepam dari tekanan atmosfera ke tekanan vakum ultra. Terangkan pam-pam yang diperlukan untuk mendapatkan paras vakum ultra dari tekanan atmosfera. (6/20)
- (b) Mekanisma kegagalan pada litar bersepadu merupakan proses fizik dan kimia yang berlaku sehingga membawa kepada kerosakan dalaman dan tidak berfungsi mengikut spesifikasi. Huraikan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kegagalan tersebut. (6/20)
- (c) Lakarkan aliran proses fabrikasi nMOS get logam. (8/20)